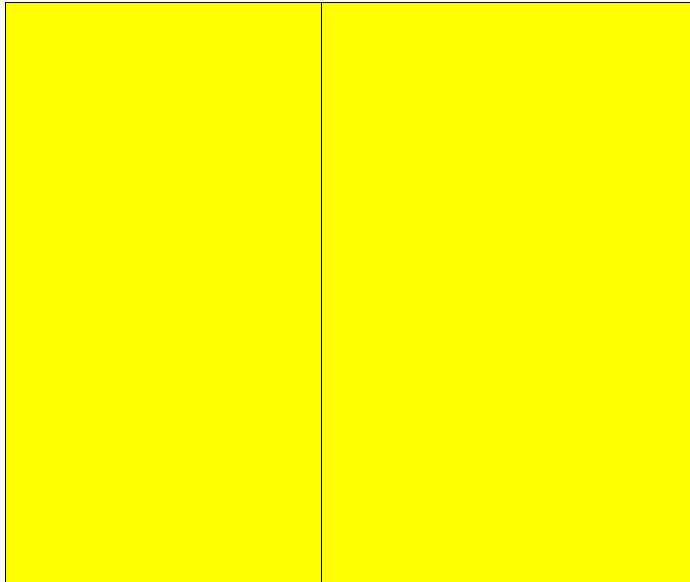


Teilnahme- informationen

Um Anmeldung bitten wir per Fax
auf beiliegendem Antwortformular oder
per e-mail bis spätestens 31.01.2004 an:

Frau Manuela Büttner
Tel.: +49 (0) 30 – 81 04 18 29
Fax: +49 (0) 30 – 81 04 18 27
e-mail: manuela.buettner@bam.de



Anfahrt

Bahn: von Bhf. Zoo mit der S-Bahn (jede Linie) bis Friedrichstraße, von dort S-Bahn S1 bis Botanischer Garten, 5 min Fußweg zur BAM, Zweiggelände Fabeckstraße
Auto: Südlicher Berliner Ring bis Dreieck Nuthetal, Richtung Berlin bis Abfahrt Zehlendorf, stadteinwärts Richtung Steglitz

Unterkunft

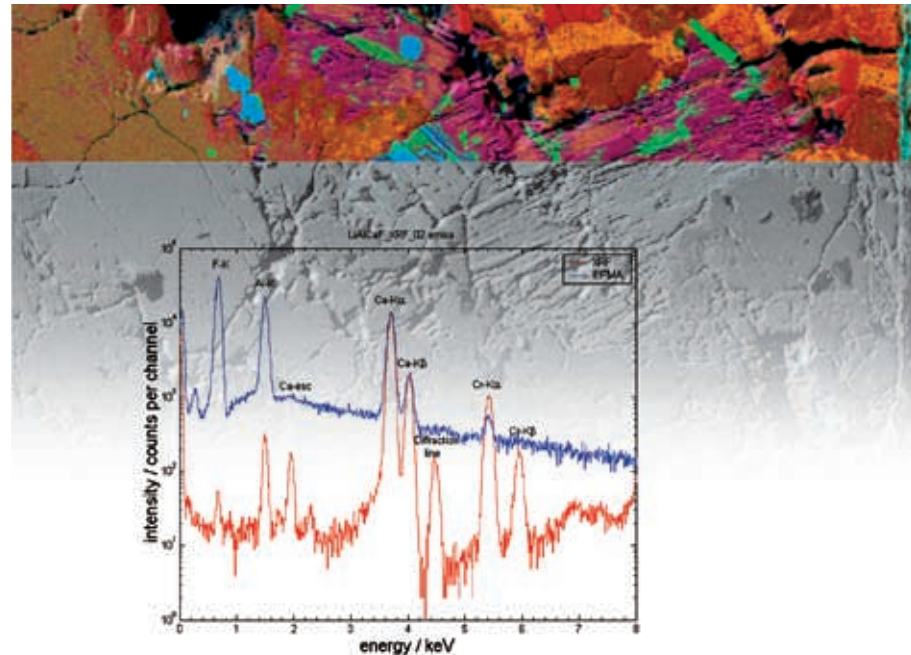
BAM-Besucher können in Hotels und Pensionen in der Nähe der BAM zu besonderen Konditionen buchen. Eine Aufstellung dieser Hotels und Pensionen ist unter: www.bam.de/hotels.htm zu finden.

Kolloquium

Neue Analysemethoden am
Rasterelektronenmikroskop

Röntgenfluoreszenzanalyse

EDX-Analyse mit
Silizium-Driftdetektoren



4. und 5. März 2004

BAM – Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung
12203 Berlin
Unter den Eichen 44/46
Haus 89, Raum 120



RÖNTEC

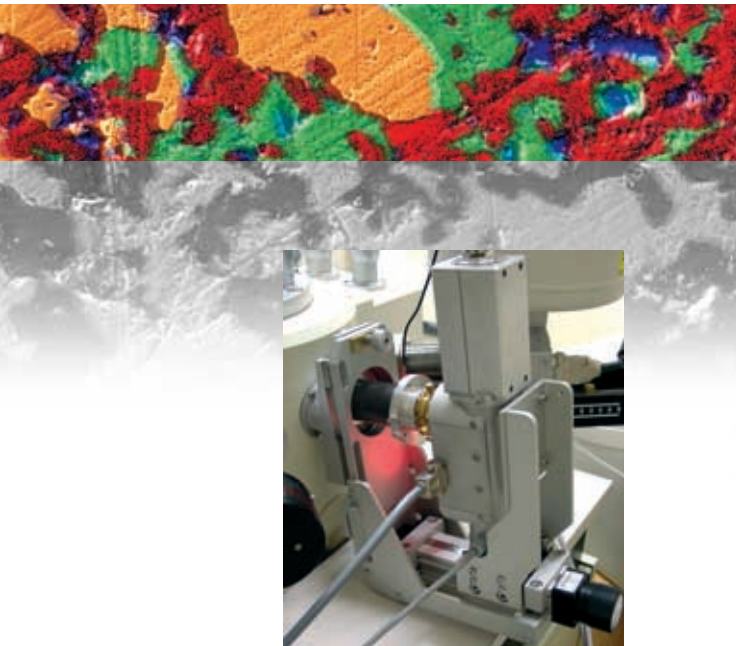


DO 4.3.2004

Neue Analysemethoden am Rasterelektronenmikroskop

Röntgenfluoreszenzanalyse

EDX-Analyse mit
Silizium-Driftdetektoren



- 13.00 Uhr Eröffnung
Prof. Dr. G. Reiners
Leiter der Fachgruppe Oberflächentechnologien, BAM
-
- 13.10 Uhr Organisatorische Hinweise
Dr. M. Procop, BAM
-
- 13.15 Uhr Röntgenfluoreszenzanalyse am Rasterelektronenmikroskop,
Vor- und Nachteile gegenüber der
Elektronenstrahlmikroanalyse
Dr. M. Procop, BAM
-
- 14.00 Uhr iMOXS – eine neu entwickelte Röntgenquelle
mit effektiven austauschbaren Kapillaroptiken.
Prof. Dr. N. Langhoff, IfG GmbH
Dr. A. Bjeoumikhov, IfG GmbH
-
- 14.45 Uhr General aspects of WinAxil software and its performance
V. Osorio, Canberra Eurisys Benelux NV/SA
-
- 15.30 Uhr Standardfreie Quantifizierung für die
Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse
Dr. M. Haschke, Röntgenanalytik Messtechnik GmbH
-
- 16.15 Uhr *Kaffeepause*
-
- 16.45 Uhr RÖNTEC QUANTAX – eine neue EDX-Generation
mit »stickstofffreien« Silizium-Driftdetektoren
Dipl.-Ing. G. Kommichau, RÖNTEC GmbH
-
- 17.30 Uhr Ultraschnelles Elementmapping mit dem RÖNTEC ColorSEM
Dr. H. Schuricht, RÖNTEC GmbH
-
- 18.30 Uhr Berliner Abend
gesponsert durch IFG GmbH und RÖNTEC GmbH

FR 5.3.2004

- 9.00 bis 12.00 Uhr Demonstration der Geräte an den
REM's im BAM-Labor VIII.23
Die Demonstration erfolgt in kleineren Gruppen